



UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

Wydział Chemii



Mikroskopia sił atomowych (AFM)

Wyposażenie laboratorium:

1. Mikroskop AFM/STM serii Nanoscope 3a, Bruker(Digital Instruments).

Cechy instrumentu i dostępne techniki pomiarowe:

- Kontaktowy tryb AFM
- Tryb TM-AFM
- Skaner typu E - zakres pomiarów do 12 mikronów w płaszczyźnie X/Y i do 3 mikronów w płaszczyźnie Z.

2. Mikroskop AFM/STM serii Nanoscope 8 (kontroler Nanoscope V), Bruker.

Cechy instrumentu i dostępne techniki pomiarowe:

- Kontaktowy tryb AFM
- Tryb TM-AFM
- Tryb PeakForce[®] Tapping[®], wyznaczanie właściwości nanomechanicznych (jakościowych) próbki
- Skaner typu J - zakres pomiarów do 100 mikronów w płaszczyźnie X/Y i do 3 mikronów w płaszczyźnie Z.